実環境雑音下におけるインパルス応答測定波形の

最適切り出し方法の検討

渋澤 功 * 金田 豊 *

* 東京電機大学大学院工学研究科 〒120-8551 東京都足立区千住旭町5番 E-mail: * [11kmc19@ms, kaneda@c].dendai.ac.jp

あらまし インパルス応答はスピーカや室内の音響特性についての情報を数多く含んでいる。そのためインパル ス応答の測定は大変重要である。しかし、測定環境において室内騒音などが付加されて SN 比が低下するという問 題がある。従来は通常,インパルス応答を時間軸上で切り出していたが、SN 比の良い周波数成分を切り捨ててしま うという問題があった。本報告では Wiener Filter と帯域別切り出しを利用して従来法の問題点を改善した手法を提 案した。そして、提案法を用いた雑音下における最適な切り出し法について検討した。その結果、1)従来法に比べ 提案法の方が真値との平均二乗誤差が低減し提案法の有効性を確認できた、2)実環境雑音下において非定常雑音が 発生しうる環境下では TSP 法よりも M 系列法のほうが雑音の影響を受けにくい測定が行えるということがわかっ た。

キーワード インパルス応答, 切り出し, Wiener Filter, TSP 法、M 系列法

A study on impulse response waveform extraction under environmental noise

Isao SHIBUSAWA[†] Yutaka KANEDA[†]

[†] Graduate school of Engineering, Tokyo Denki University,

5 Senju-Asahi-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-8551, Japan E-mail: †[11kmc19@ms, kaneda@c].dendai.ac.jp

Abstract The impulse response contains a large amount of information about the acoustic characteristics of a loudspeaker or a room. Therefore, the measurement of the impulse response is very important. However, the SN ratio is reduced when environmental noise is added. To increase the SN ratio, the impulse response can be extracted on the time axis. However, this discauses loss of the frequency components with a high SN ratio. In this paper, we propose a new method that mitigates the problems of the conventional method using a frequency-band-wise extraction and Wiener filter, and we study the extraction under real environmental noise. As a result, 1) the effectiveness of the proposed method is confirmed from the reduced mean squared error, 2) under a non-stationary noise environment, the MLS method is less affected by noise than the TSP method.

Keywords impulse response, response extraction, Wiener filter, TSP method, MLS method

1. はじめに

インパルス応答(IR:Impulse Response)はスピーカや 室内の音響特性についての情報を数多く含んでいる。 そのため、IRの測定は大変重要である[1]。しかし、測 定環境において室内騒音などが付加されて SN 比が低 下するという問題がある。この問題に対してこれまで 様々な方向からの改善が試みられてきた[2]。本稿では 実環境雑音下において計測した IR 波形を時間軸上で 切り出すことで SN比を向上する手法の検討を行った。 一般に IR の測定は十分に長いデータ長で行われる ので、測定結果の後半は雑音区間(もしくは IR が雑音 より十分に小さい区間)となっている。この測定結果を そのまま使うと不要な雑音が多く含まれることで SN 比が悪くなる。そのため、雑音部分を切り捨てて必要 な部分のみを切り出す操作が必要となる。

図1は定常雑音が付加された IR 波形のモデル図で ある。縦ハッチ部分が IR、斜ハッチ部分が雑音を表し ている。従来の多くの方法ではインパルス応答の短時 間パワーが雑音パワーと等しくなる時刻(図1の破線) 付近で切り出しが行われてきた[3][4]。 この時間波形における切り出し(以降「波形切り出し」 と呼ぶ)は IR に含まれる全周波数成分を同一時刻で切 り出すものである。しかし、実際には周波数によって IR の長さは異なり、また雑音のパワーも異なる。図 2 は、実測した室内インパルス応答(室容積120m³、残響 時間 0.6s)に、標準的な室内騒音である Hoth 雑音[5]を 付加した場合のスペクトログラムで、横軸に時間、縦 軸に周波数として表したものである。雑音の低域成分 のパワーが大きいため、図 1 のモデル図に示すように 約 30ms で IR の短時間と雑音の短時間パワーは等しく なり、0~30ms の範囲で IR は切り出される。

この波形切り出しは、図2の破線に示すように全帯 域同一時刻で切り出しが行われることになる。しかし、 高周波域ではIRも長時間継続しており、また雑音成分 も少ない。全帯域での切り出しを行った場合、図2に 丸印で囲った、SNの高い周波数成分の応答が切り捨て られるため、誤差要因となる。

この問題を解決するため、本報告では Wiener Filter を用いて帯域別の雑音抑圧を行い、その後、帯域別の 切り出し時刻で IR の切り出しを行う方法を提案する。

2. Wiener Filtering

信号の SN 比を向上させる代表的な手法として Wiener Filtering(以下 WF)がある[6]。この手法は測定信 号の平均二乗誤差を最小にするフィルタを用いて雑音 を抑圧する手法である。

WF は測定信号の短時間フーリエ変換に作用する時 変フィルタで次式の時間-周波数特性G(n,k)を持つ。

$$G(n,k) = P_s(n,k) / (P_s(n,k) + P_N(k))$$
(1)

ただし、n は離散時間を表し、k は離散周波数を表す。 また、雑音は定常雑音を仮定し $P_N(k)$ は雑音の短時間 パワースペクトルの平均値、 $P_s(n,k)$ は信号(真値)の短 時間パワースペクトルを表す。式(1)より、ある時間一 周波数区間において、 $P_s(n,k) \gg P_N(k)$ であれば $G(n,k) \approx 1$ となって信号はそのまま出力される。一方、 $P_s(n,k) \ll P_N(k)$ すなわち、ほぼ雑音のみの区間であれ ば $G(n,k) \approx 0$ となって雑音は抑圧される。

しかし、現実的には真値は知ることができないので雑 音を含んだ測定結果のパワースペクトル*P_{SN}(n,k)*を用 いて

$$G(n,k) = (P_{SN}(n,k) - P_N(k))/P_{SN}(n,k)$$
(2)

と近似計算した特性を用いる。







図 2 Hoth 雑音が加わったインパルス応答(IR)のスペ クトログラムと時間波形上で切り出し(全帯域での 切り出し)の欠点

3. 提案する手法

本稿で提案する手法の処理手順を図3に従って説明 する。

① 雑音が加わった IR に短時間フーリエ変換を行って サブバンド信号とする。

②このサブバンド信号に WF を行う。ただし WF にお ける雑音のパワースペクトル $P_N(k)$ は測定された信号 において雑音のみが含まれると考えられる時間区間を 用いて計算しておく。また、式(2)の分子項が負値にな る場合はG(n,k) = 0 とした。

③WF 出力に対して帯域別切り出しを行ってインパ ルス応答収束時刻以降の雑音成分を抑圧する。(詳細は 4節)

④サブバンド信号を逆 DFT し、overlap-add 法によって IR を再合成する。



4. 帯域別切り出しの検討

WF は平均的な雑音パワーを用いて雑音を抑圧する。 従って IR が収束して、雑音のみとなった時間-周波数 区間(P_{SN}(n,k)に雑音のみしか含まれていない区間)で あっても、雑音が平均値よりも大きい場合には式(2) の分子は0とはならず雑音は残ってしまい誤差要因と なる。そこで、信号に WF 法を適用したあとに帯域別 切り出しを行って誤差の抑圧を行う。

ここで、式(2)の分子項が負値になる場合について考 えてみると

$$P_{SN}(n,k) - P_N(k) = P_S(n,k) + \tilde{P}_N(n,k) - P(k) \le 0 \quad (3)$$

すなわち

$$P_{S}(n,k) \le P(k) - \tilde{P}_{N}(n,k) \tag{4}$$

ただし、 $P_S(n,k)$ は IR の真値、 $\tilde{P}_N(n,k)$ は雑音パワーの時間-周波数瞬時値である。

式(4)は IR の真値が雑音の平均値からの瞬時変動よ り小さい。言い換えると IR が雑音の変動以下に収束し ていることを表す。よって本手法では式(2)の分子項が 最初に負値となった時刻を IR の切り出し時刻と定め るものとする。次にこの事の妥当性を確認するために 行ったシミュレーションについて述べる。

まず、高い SN 比で室内インパルス応答(残響時間 0.6 秒)を測定し、これを「真値」と考える。次に、 これに Hoth 雑音を付加したものを処理対象とした。イ ンパルス応答は窓長 32 のハニング窓を用いシフト長1 で短時間フーリエ変換を行った。図4,5,6 にそれぞれ、 真値波形、WF を行う前および後の波形を示す。ただ し、波形は750-2250Hz 帯域のサブバンド信号を時間波 形に変換して示した。図より、WF 処理前(図5)に見ら









図 6 WF を適用した後の 750-2250Hz 帯域の IR

れた雑音成分は処理後(図 6)において大幅に抑圧され ていることがわかるが、消し残り雑音波形が見られる。 次に図 6 の波形をさまざまな時刻で切り出した場合 の真値との誤差を計算した。図7は、図6のIRの切り 出し時刻τを横軸に、縦軸をその切り出し時刻におけるIR波形誤差E(τ)

$$\mathbf{E}(\tau) = \sum_{n} \left(|h(n)| - \left| \hat{h}(\tau, n) \right| \right)^{2} / \sum_{n} |h(n)|^{2}$$

を表している。ただし、h(n), $\hat{h}(r,n)$ はそれぞれ真値および WF 適用後に切り出した IR 波形(750-2250Hz)である。

図より最も誤差が小さかった時刻は式(2)の分子項 が最初に負値となる時刻に近い結果となった。また、 ほかの周波数帯域についても同じような結果となり、 提案する切り出しの時刻の妥当性が確認された。

最後に時間波形で切り出しを行った場合(波形切り 出し)との性能比較を行った。シミュレーション条件は 同じものとした。波形切り出しをした結果は図2のス ペクトログラムの切り出し時刻の左側の部分である。 一方、図8に提案法を適用したIRのスペクトログラム を示す。波形切り出し法では切り捨てられていた 30ms 以降の部分が提案法では保存されている。

次に波形切り出しおよび提案法で得られたインパ ルス応答をフーリエ変換して周波数振幅特性を求め、 真値の周波数振幅特性との誤差を周波数帯域ごとに計 算し、その結果を図9の太線と破線に示す。図より提 案法の方が3k~12kHzにおいて10dB程度誤差が減少 していることがわかる。このことより提案法の有効性 を確認することができた。

5. 実環境測定の問題点と対策

提案法は定常雑音を前提とするものである。しかし、 実環境にはドアの開閉音や歩行音、衝撃音などの非定 常雑音が発生する可能性がある。以下ではこの非定常 雑音が本手法に及ぼす影響について検討した。

IR 測定信号の代表的なものとして掃引正弦波の一 つである TSP 信号と擬似雑音の一つである M 系列法 が知られている。これら2つの信号を用いた場合の非 定常雑音の影響についてシミュレーションを行った。

まず最初に TSP 法を用いたシミュレーション結果に ついて述べる。IR はこれまでと同じ室内 IR を用いた。 この IR を TSP 信号とたたみこんで TSP 応答を計算し、 これに非定常雑音を加算した。非定常雑音としては、 別途録音した机を叩く音を用い、そのスペクトログラ ムを図 10 に示す。非定常雑音には室内の低周波定常雑 音が付加されたものとなっている。そして、 TSP 応答 に非定常雑音を付加した時のスペクトログラムを図 11 に示す。図において時刻 0 から直線的に周波数が上 昇する TSP 応答に、300ms 付近で非定常雑音が加算さ



図7 切り出し時刻τと IR 波形の誤差E(τ)



図8 提案法を適用した IR のスペクトログラム



図9 周波数振幅特性の周波数帯域ごとの誤差

れている。次に TSP 応答に逆 TSP 信号を畳み込み IR を求めた。求めた IR のスペクトログラムを図 12 に示 す。図より TSP 法で求めた IR は非定常雑音の影響を



図 10 今回用いた非定常雑音

強く受けているということがわかる。

次に図 12 の IR に対して提案法を適用した IR のス ペクトログラムを図 13 に示す。図より非定常雑音下で は提案法を用いても雑音が抑圧できず大きな誤差が発 生していることが分かる。また、WF では IR の存在し ていない時間区間(たとえば図 12 の 400ms 以降)におい て定常雑音のパワースペクトルP_N(k)を推定するが、こ の区間に非定常雑音が存在するとP_N(k)が誤推定され、 大きな誤差要因となる。

次に M 系列を用いたシミュレーション結果につい て述べる。シミュレートした M 系列応答に非定常雑音 を付加した場合のスペクトログラムを図 14 に示す。図 より M 系列応答のスペクトログラムは測定時間全体 にランダムに分布していること、および、300ms 付近 に非定常雑音が存在することがわかる。次に M 系列応 答に逆 M 系列信号を畳み込んで求めた IR のスペクト ログラムを図 15 に示す。図より M 系列法で求めた IR においては、非定常雑音が測定時間全体的に拡散して、 定常雑音化していることがわかる。

次に図 15 の IR に対して提案法を適用した IR のス ペクトログラムを図 16 に示す。非定常雑音が定常化さ れているので提案法がうまく機能し雑音成分の抑圧が できていることが分かる。図 17 に図 13 および図 16 の場合の周波数帯域ごとの誤差を示す。図より、非定 常雑音の影響を受けていない高周波域では TSP の誤差 が小さいが全体としては M 系列法が有利であること が分かる。

以上の結果から実環境において非定常雑音が混入 する可能性のある部屋などで測定をする際には M 系 列法を用いて測定すれば提案法を有効に使用できると いうことがわかった。



図 11 非定常雑音を付加した TSP 応答









図 14 非定常雑音を付加した M 系列応答







図 16 図 15 の IR に提案法を適用した IR



図 17 TSP 法と M 系列法での周波数振幅特性の周 波数帯域ごとの誤差

6. むすび

本稿では、計測したインパルス応答(IR:Impulse Response)に含まれる雑音成分の低減方法として Wiener Filtering(WF)と帯域別切り出しを利用した手法 を提案した。WF は通常、残留雑音の問題があること が知られている。そこで、提案法では、帯域分割を行 ったインパルス応答にWFを適用した後、出力が最初 に零となる時刻(測定結果の短時間パワーが平均的雑 音パワーより小さくなる時刻)以前の帯域信号を切り 出すことで残留雑音の低減を行う。室内 IR を用いたシ ミュレーションにより、この切り出し時刻の妥当性、 および時間波形そのものをある時刻で切り出す方法に 対する有効性を示した。

今回提案した方法は定常雑音を前提としているが 実環境では非定常雑音の影響を受ける場合も多い。イ ンパルス応答測定信号である TSP と M 系列を比較し た結果、非定常雑音環境下では、非定常雑音を定常雑 音化する M 系列法が本手法には適していることを示 した。

文 献

[1] 橘 秀樹, ''室内音響測定の現状と今後の課題,''日本音響学会誌
49(2), pp.97-102, (1993).

[2] 落合裕一,金田豊,"全帯域でSN比を一定とするインパルス応答測定信号(CSN-TSP)の実環境における有効性の検討,"音響学会 秋季講演論文集, 3-10-11, pp.621-622, (2010/09).

[3] L. Faiget, C. Legros, and R. Ruiz, "Optimization of the Impulse

Response Length: Application to Noisy and Highly Reverberant Rooms," J. Audio Eng. Soc, 46, 9, (1998).

[4] ISO 3382-1:2009(E) pp.8.

[5] IEEE P269/D9, pp. 80-82, Jan. 2002.

[6] 浅野 太, ''音のアレイ信号処理'' pp.48-54, 日本音響学会 (2011).